

Afisarea articolelor -19-0(1) pentru cuvântul-cheie "Charge accumulation"

Numeric modeling and analytical solution of ionizing irradiation induced charge in MOSFET structure oxide

Rusanovschi Vitalie¹, Avram Adrian Adrian²

¹ State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova ,

² Politehnica University of Timisoara

Symposium on Electronics and Telecommunications

Ediția 11. 2015. New Jersey. [ISBN 978-147997265-4](#).

Disponibil online 2 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-300



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Actualizat: 04.06.2024, accesat: 04.06.2024

Disponibil: <https://ibn.idsi.md>

